

CURSO

Surface Area, and X-Ray diffraction/Rietveld refinement method - Theory and Practice



Dr. Peter Weidler

Thirty-hour lectures at UFMG about Surface Area, X-ray diffraction/Rietveld refinement method for post graduate students and researchers. The course will cover principles, instrumentation, sample preparation, data acquisition and analyses.

Dr. Peter Georg WEIDLER, head of division Chemistry of Oxidic and Organic Interfaces, Institute for Functional Interfaces – Karlsruhe Institute of Technology KIT, Karlsruhe, Germany.

Inscrições
inctacqua@gmail.com
F:3409-1825 (14-17h)

OUTUBRO

SEG 21
TER 22 29
QUI 24 31

NOVEMBRO

04 11 18
12
14

2019

Período de Inscrição: até 18 de outubro

Público alvo: alunos e pesquisadores.

Vagas: 18

Obs: créditos poderão ser atribuídos aos aprovados em avaliação.

Horário:
13:50 às 16:50

Escola de Engenharia
UFMG
Sala 2240- Bloco II

